

g i b k i

JAN GIBKI

Jan Gibki urodził się 8 maja 1951 roku w Zgierzu, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. W 1969 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W czasie studiów odbył 6-tygodniową praktykę w Instytucie Radiotechniki w Moskwie. W 1974 roku uzyskał stopień magistra elektroniki, specjalność Automatyka. Po odbyciu szkolenia wojskowego w 1975 roku został mianowany na podporucznika rezerwy. W latach 1975–1982 pracował w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku starszego asystenta naukowo-badawczego, prowadząc zajęcia dydaktyczne, projektując subnanosekundowe mierniki czasu i minikomputery z wykorzystaniem układów serii 6800. W tym czasie prowadził również prace o charakterze teoretycznym związane z analizą wrażliwości układów elektronicznych, efektywnym całkowaniem równań różniczkowych i przetwarzaniem macierzy rzadkich z wykorzystaniem maszyn cyfrowych. Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną trwała do 1990 roku i polegała na współudziale w projektowaniu i oprogramowywaniu automatycznych systemów pomiarowych, znakowarek laserowych i medycznych urządzeń laserowych. W latach 1982–1983 w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników „CEMI” kierował pomiarami kwalifikacyjnymi układów scalonych. Od 1983 roku był zatrudniony na stanowisku konstruktora w Zakładzie Opracowania i Produkcji Aparatury Pomiarowej „ZOPAN”, projektując generatory impulsowe



we i sterowniki mikroprocesorowe. W latach 1986–1998 pracował w Instytucie Technologii Elektronowej, zajmując się modelowaniem i diagnostyką elementów elektronicznych. W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych (specjalność Elektronika Półprzewodnikowa). Od 1998 roku pracuje w Politechnice Warszawskiej na stanowisku starszego wykładowcy, prowadząc laboratoria w Zespole Laboratoriów „Przyrządy półprzewodnikowe” i wykłady z przedmiotu „Metody diagnostyki elementów elektronicznych” na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Jest współautorem czterech patentów i autorem lub współautorem około czterdziestu publikacji z dziedziny wrażliwości układów elektronicznych, zastosowań sterowników mikrokomputerowych, ekstrakcji parametrów i diagnostyki elementów elektronicznych.

Słowa kluczowe

- systemy pomiarowe
- diagnostyka elementów półprzewodnikowych